CdTe 薄膜太阳电池背接触的研究*

贺剑雄*郑家贵李卫冯良桓蔡伟 蔡亚平

张静全 黎 兵 雷 智 武莉莉 王文武

(四川大学材料科学与工程学院,成都 610064)(2006 年 8 月 31 日收到 2007 年 1 月 26 日收到修改稿)

用近空间升华法制备了 CdTe 多晶薄膜,用硝酸-磷酸 NP ,混合液对薄膜表面进行了腐蚀.经 SEM 观测,腐蚀后 的 CdTe 薄膜晶界变宽,XRD 测试发现 经 NP 腐蚀后,在 CdTe 薄膜表面生成了一层高电导的富 Te 层.在腐蚀后的 CdTe 薄膜上分别制备了 Cu, Cu/ZnTe :Cu,ZnTe :Cu,ZnTe :Cu 四种背接触层,比较了它们对太阳电池性能的影响.结果表明,用 ZnTe/ZnTe :Cu 复合层作为背接触层的效果较好,获得了面积为 0.5 cm²,转换效率为 13.38% 的 CdTe 多晶薄膜太阳电池.

关键词:硝磷酸腐蚀,背接触层,CdTe太阳电池 PACC:8160C,7340L,7360L

1.引 言

CdTe 多晶薄膜是一种重要的光电材料,光能隙 为 1.45 eV,是公认的理想太阳电池材料¹¹.在太阳 电池制备中,由于 CdTe 的自补偿效应而不易高掺 杂,它的电子亲和势高,高功函数的金属与 p-CdTe 将形成肖特基势垒.而且,由于表面局部费米能级的 钉扎效应,增加了形成低电阻接触的困难^[23].

实验表明,用腐蚀液对 CdTe 薄膜进行处理改变 表面的化学构成,既能消除因退火而产生的氧化层, 又可以形成低电阻接触,是 CdTe 太阳电池研制中的 关键技术.常用的腐蚀液为溴甲醇(BM)和 K₂Cr₂O₇: H₂SO₄(KD)^{4→7]}. Danaher 等人^[5]的研究表明,尽管 BM和 KD 腐蚀液在 CdTe 薄膜表面生成富 Te 层,但 是这些腐蚀液有一些严重的缺点.用 KD 处理的表 面形成一层阻碍形成低电阻接触的 TeO₂ 层.用 BM 处理的表面,Br 穿过 CdTe 薄膜并在 CdS/CdTe 界面 积聚.因此,寻找新的腐蚀溶液和腐蚀工艺成为 CdTe 太阳电池研究中的重要课题.

我们用硝酸-磷酸 NP)腐蚀液对 CdTe 多晶薄膜 表面进行了腐蚀,研究了不同时间腐蚀后薄膜结构 的变化,并在腐蚀后的 CdTe 多晶薄膜上制备了四种 不同结构的背接触层,比较了它们对 CdTe 太阳电池 性能的影响.

2.实验

2.1. 样品的制备

本实验样品的窗口层 n-CdS 用化学水浴法 (CBD)在有 SnO,:F 薄膜的玻璃上沉积,吸收层 p-CdTe 薄膜采用我们自己设计的近空间升华系统制 备,源与衬底分别用碘钨灯加热 通过调制加热功率 来改变与控制它们的温度,沉积过程在氩、氮和空气 中进行 真空度为 10⁻¹ Pa. 用高纯氮作为保护气体, 样品在 CdCl, 蒸气氛围、385℃下热处理 20 min.热处 理后的 CdTe 样品用硝酸-磷酸混合溶液进行表面处 理.NP 溶液中 HNO3(65%),H3PO4(85%)与去离子 水的体积比为 1:70:30 腐蚀时间为 60 s. 用我们自 己设计的共蒸发系统沉积 Cu ,ZnTe ,ZnTe :Cu ,系统 的真空度为 10⁻⁴ Pa,沉积时两个独立的源被隔板分 开,分别加热,两个石英探头分别对 ZnTe 和 Cu 的沉 积速率及累计厚度做同步监控,以控制掺铜浓度及 膜的厚度^[8]. Ni 采用电子束蒸发沉积,沉积 Ni 膜时 的真空度为(2-3)×10⁻³ Pa.

† E-mail :xiaoxiong174@163.com

^{*} 国家高技术研究与发展计划(批准号:2003AA513010),中国高校博士点基金(批准号:20050610024),四川省应用基础项目(批准号: 2006J13-083)资助的课题.

2.2. 样品的测试

X 射线衍射测试在辽宁丹东射线集团有限公司生产的 DX-1000 X 射线衍射仪上进行,使用 CuKα (λ = 0.154184 nm)辐射测试,扫描范围 2θ 为 10°— 90° 扫描速度 0.06°/s.薄膜的表面形貌采用 Hitachi S-450 型扫描电镜(SEM)观测.组分由英国 KRATOS CO 的 XSAM800 型 X 射线光电子能谱(XPS) 议获得 辐射 源为 Mg-Kα.光照下太阳电池的输出特性和性能参数 是用西安交通大学研制的太阳电池测试仪测试,光源 为 TG-X1000 型长弧氙灯,入射光强为100 mW/cm².

3. 结果与讨论

3.1. NP 腐蚀 CdTe 多晶薄膜

3.1.1. 实验过程及现象

在室温下,将样品浸入 NP 腐蚀溶液中,5—10 s 后在 CdTe 多晶薄膜样品的局部表面看到有白色气 泡出现,随着腐蚀时间的增加,样品上出现气泡的面 积逐渐扩大 20 s 后在整个样品表面都观察到气泡. 腐蚀中观察到的气泡为反应过程中的副产品.随着 反应时间的增加,气泡变大,在整个反应过程中气泡 一直覆盖在 CdTe 表面,这是由于 NP 腐蚀溶液的黏 性而引起.CdTe 表面经过 NP 腐蚀后颜色由原来的 暗灰色变为银灰色,之后颜色不随腐蚀时间而变化. 3.1.2. 腐蚀前后样品的 SEM 图谱

我们观测了 NP 腐蚀对 CdTe 多晶薄膜的表面 形貌的影响,如图 1 所示.SEM 图显示出 NP 腐蚀液 对表面和晶界具有很强的腐蚀效果.腐蚀前 表面是 很粗糙,晶粒也比较致密(如图 1(a)(b)).腐蚀后, 晶界变宽,而且表面更光滑和具有光泽(如图 1(c), (d)).

3.1.3.NP 腐蚀液腐蚀样品后的 XRD 图谱



图 1 NP 腐蚀 CdTe 表面的 SEM 图片 (a) NPX 1:10:0)腐蚀前 (b) NPI(1:70:30)腐蚀前 (c) NPX 1:10:0)腐蚀 60 s (d) NPI(1:70:30)腐蚀 50 s



图 2 不同腐蚀时间 XRD 图谱

图 2 为 CdTe 薄膜经不同时间腐蚀后的 XRD 图.从图中可以看出经过 10 s 腐蚀后出现了六方结 构的 Te(101)衍射峰,而且随着腐蚀时间增加,峰值 增强.同时,CdTe(220)和(311)峰也随着腐蚀时间的 增加而减小.因此,我们认为,经 NP 腐蚀液腐蚀的 CdTe 薄膜表面有六方结构的 Te 产生.Te 的带隙宽 度只有 0.33 eV,这么窄的带隙几乎可以吸收所有波 长的太阳光.但是在 p-CdTe 与 Te 之间会存在一个 反向势垒阻碍电子向前电极的移动,使电子和空穴 在此处复合,使 Te 层不能与金属电极形成很好的欧 姆接触.因此会影响 CdTe 太阳电池的性能,从表 1 看出,NP 腐蚀后直接沉积 Ni 电极得到的电池效率 很低.

3.2. 不同背接触层对器件性能的影响

为了获得低电阻接触,我们用相同的制备条件

制备了 CdTe 薄膜 经相同的 NP 腐蚀条件和腐蚀时间

腐蚀后,分别制备了 Cu ,Cu/ZnTe :Cu ,ZnTe :Cu ,ZnTe/ ZnTe :Cu 四种背接触层 比较了各类电池的性能. 3.2.1.Cu/Ni 背接触层

我们在 NP 腐蚀后的 CdTe 薄膜表面沉积一层 厚度为 2.5 nm 的 Cu 在氮气保护 190℃下暗场退火 40 min.为了研究退火后薄膜微结构的变化 我们对







图 4 Cu 薄膜退火前后的 XRD 图谱 沉积 Cu 后的样品退火前后组分的变化进行了 XBD 测试.图 3 是样品的 XRD 图谱,从图中看出,退火之 后出现了 Cu1.44 Te 的衍射峰 而且 Te 的(101)衍射峰 有所增强,但是在退火前后都没有 Cu 的衍射峰出 现,为了理解上述实验事实,我们在载玻片上沉积了 一层厚度为 40 nm 的 Cu,对未退火及经 190℃退火 的样品进行了 XRD 测试,如图 4.从图中看出,未退 火的 Cu 膜是非晶态 经 190℃退火后 ,晶粒长大 ,并 出现少许结晶.我们认为,用共蒸发沉积的 Cu 是非 晶态,随着温度的升高,Cu离化为Cu*和Cu*+,并 且和 Te 结合生成碲铜相 除了生成 Cu, M Te 外 还可 能生成 CuTe 和 Cu, Te. 图 5 所示为退火前的 XPS 全 谱图.图6为退火前Cu的精细谱图.图7所示为退 火后剥离 15 Å 后的 XPS 的全谱图,从全谱上很容易 地看到 Cu, Te, C, O 元素的存在, 但是 Cu 元素的峰 很弱, Te 元素的峰很强, O 元素可能是由于表面吸 附或者 Te 氧化引起的.从全谱上可以看到出现了 Cd的峰,但是非常微弱,结合XRD表明NP腐蚀后



图 5 沉积 Cu 后退火前的 XPS 的全谱图



退火前 Cu 的精细谱图 图 6



图 7 退火后剥离 15 Å 后的全谱图

有 Te 存在. 从表 1 中看出,采用 Cu/Ni 背接触层的 CdTe 太阳电池的转换效率及填充因子相比 NP 腐蚀 后直接沉积 Ni 电极的 CdTe 太阳电池高,这是因为 在经过退火处理后形成了 Cu, Te 相. Cu/Ni 背接触 层 实际上是 Cu_xTe/Ni 背接触层. Cu_xTe 的带隙在 1.1—1.4 eV 之间 ,Cu_xTe 和 p-CdTe 之间只有很小的 导带不连续性,形成一个小的势垒.这个很小的势垒 对电子的移动阻碍很小,有利于空穴的运动.

3.2.2.Cu/ZnTe :Cu 背接触层

我们在 NP 腐蚀后的 CdTe 薄膜表面采用共蒸 发法沉积 Cu/ZnTe :Cu 背接触层,并分别在 190℃, 195℃下退火,然后用电子束蒸发沉积一层 Ni 作电 极.从表 1 中看出,用 Cu/ZnTe :Cu/Ni 结构作背接触 层的电池性能有较大幅度提高,我们认为虽然用 Cu_xTe 背接触可使 CdTe 太阳电池的性能得到改善, 但是由于在背电极处没有反射电子的势垒,因此有 可能会使电子向背电极漂移,在背电极处复合.为 此,引入 ZnTe :Cu 层后改善了电池的短路电流,从而 使转换效率提高.由于 ZnTe :Cu 的带隙为 2.26 eV, 使 Cu_xTe 与背电极之间形成一个势垒,反射向背电 极漂移的电子.

表 1 不同背接触层 CdTe 太阳电池的性能参数

背接触	退火温度/℃	开路电压 V _{OC} /V	短路电流 I _{sc} /mA	填充因子 FF/%	转换效率 η/%
Ni	0	0.516	1.591	38	4.413
Cu/Ni	190	0.705	1.440	55	7.860
Cu/ZnTe :Cu/Ni	190	0.710	1.640	54	8.936
	195	0.742	1.734	51	9.217
ZnTe :Cu/Ni	190	0.685	1.853	51	9.140
ZnTe/ZnTe :Cu/Ni	190	0.716	1.655	64	10.716

3.2.3.ZnTe :Cu 背接触层

我们在 NP 腐蚀样品后用共蒸发法沉积 p⁺-ZnTe :Cu 背接触层,并在 190℃下退火,然后镀 Ni.从 表 1 看出,这种背接触层的电池转换效率比 Cu/Ni 高,特别是短路电流密度 J_{sc}有较大提高.我们认为





图 9 小面积 CdTe 电池的 LV 曲线

由于 NP 择优腐蚀 CdTe 薄膜晶界,并使 CdTe 薄膜晶 界变宽,而且腐蚀后的富 Te 层是孔状结构,温度升 高后 Te 原子加快向 CdTe 多晶薄膜的晶界移动,使

56 卷

得富 Te 层的 Te 原子减少,而剩余的 Te 又可使 CdTe 薄膜的表面电阻降低,从而使电池的串联电阻减小, 根据文献 9 可知在 ZnTe :Cu 多晶薄膜中,Cu 的掺 杂水平很低,只有极少部分的 Cu 原子取代 Zn 原子, 大部分 Cu 原子处于晶界的无定型相中,在退火处 理后,这些 Cu 原子被离化并穿过 ZnTe 的晶界与 Te 生成 Cu_xTe 相,最后形成 Cu_xTe/ZnTe :Cu 背接触层, 所以电池的性能得到改善.

3.2.4.ZnTe/ZnTe :Cu 背接触层

我们在 NP 腐蚀后,采用共蒸发法沉积了 ZnTe/ ZnTe :Cu 背接触层,并在 190℃下退火,从表 1 中看 到,这种结构的太阳电池转换效率最高.我们认为, p-CdTe 与 p⁺-ZnTe :Cu 的导带产生的势垒可以有效 地反射向背电极漂移的电子,从而有效的增加收集 效率,特别是长波收集效率,但是 p⁺-ZnTe :Cu 与金 属背电极也有可能形成反向结,因而它又必须相对 地薄,这又使其反射作用降低.并且对光伏器件而 言,高势差的突变结可能伴随着更多的界面态,会带 来不利的影响.因此,我们在 NP 腐蚀 CdTe 薄膜表 面生成的富 Te 层和 ZnTe :Cu 之间引入不掺杂的 p-ZnTe 过渡层,它的引入仍然保持了 p-CdTe 与 ZnTe : Cu 之间的势垒高度,只是使原来的 1.1 eV 的势垒变 成了 0.8 eV 和 0.3 eV 的两个势垒^[10],如图 8 所示. 不掺杂的 ZnTe 层的引入,一方面有效地反射向背电 极漂移的电子,另一方面又将背接触的突变结变为 缓变结,减少了 p-CdTe 与 p⁺-ZnTe :Cu 产生的高势 差对太阳电池的不利影响,因此可以很好地改善太 阳电池的性能.我们用 ZnTe/ZnTe :Cu 复合层作为背 接触层获得了面积为 0.5 cm^2 的 CdTe 多晶薄膜太阳 电池,经天津 18 所测试,转换效率为 13.38%,如图 9 所示.

4.结 论

1. 采用 HNO₃(65%),H₃PO₄(85%)与去离子水 的体积比为1:70:30的硝酸-磷酸(NP)混合溶液对 CSS 方法制备的 CdTe 多晶薄膜进行腐蚀,腐蚀时间 为60 s.腐蚀后,薄膜的晶界变宽,表面变得光滑和 有光泽,CdTe 薄膜表面有富 Te 层生成.

2. 制作了 Cu ,Cu/ZnTe :Cu ,ZnTe :Cu ,ZnTe/ZnTe : Cu 四种背接触层 ,比较了它们对 CdTe 薄膜太阳电 池性能的影响.结果表明 ,用 ZnTe/ZnTe :Cu 复合背 接触层的电池转换效率最高.获得面积为 0.5 cm², 转换效率为 13.38%的 CdTe 多晶薄膜太阳电池.

本文中由四川大学材料科学与工程学院朱居木教授对 样品做了 XRD 的测试分析,四川大学分析测试中心陈红老 师对样品做了 XPS 测试分析,特此表示诚挚的感谢.

- [1] Xu Y ,Diao H W ,Hao H Y Zeng X B ,Liao X B 2006 Chin . Phys . 15 2397
- [2] Yang X W Zheng J G Zhang J Q Jeng L H Jai W Jai Y Li W Jai B Jei Z Wu L L 2006 Acta Phys. Sin. 55 2504 (in Chinese)
 [杨学文、郑家贵、张静全、冯良桓、蔡 伟、蔡亚平、李 卫、
 黎 兵、雷 智、武莉莉 2006 物理学报 55 2504]
- [3] X Li ,Niles D W ,Hasoon F S ,Matson R J ,Sheldon P 1999 J. Vac. Sci. Technol. A 17 805
- [4] Qin W Z Zheng J G , Cai W , Feng L H , Cai Y P Zhang J Q , Li W , Li B , Wu L L , Li Y H , Yue L Zheng H J 2005 Journal of Materials Science and Engineering 23 256 (in Chinese)[覃文治、郑家贵、 蔡 伟、冯良桓、蔡亚平、张静全、李 卫、黎 兵、武莉莉、李 阳华、岳 磊、郑华靖 2005 材料科学与工程学报 23 256]
- [5] Danaher W J ,Lyons L E ,Marychurch M ,Morris G C 1986 Appl. Surf. Sci. 27 338
- [6] Bätzner D L ,Wendt R ,Romeo A ,Zogg H ,Tiwari A N 2000 Thin

Solid Films 361 463

- [7] Dobson Kevin D ,Visoly-Fisher Iris ,Hodes Gary ,Cahen David 2000 Solar Energy Materials and Solar Cells 62 295
- [8] Li W Feng L H ,Wu L L Cai Y P Zhang J Q Zheng J G Cai W Li B ,Lei Z Zhang D M 2005 Acta Phys. Sin. 54 1879 (in Chinese)
 [李 卫、冯良桓、武莉莉、蔡亚平、张静全、郑家贵、蔡 伟、 黎 兵、雷 智、张冬梅 2005 物理学报 54 1879]
- [9] Zheng J G, Zhang J Q, Cai W, Li B, Cai Y P, Feng L H 2001 Chinese Journal of Semiconductors 22 171 (in Chinese)[郑家贵、 张静全、蔡 伟、黎 兵、蔡亚平、冯良桓 2001 半导体学报 22 171]
- [10] Feng L H , Cai W Zheng J G , Cai Y P , Li B , Zhang J Q , Wu L L , Zhu J M , Shao Y 2001 Acta Energiae Solaris Sinica 22 403 (in Chinese)[冯良桓、蔡 伟、郑家贵、蔡亚平、黎 兵、张静全、 武莉莉、朱居木、邵 烨 2001 太阳能学报 22 403]

A study of back contacts of CdTe thin film solar cells *

He Jian-Xiong[†] Zheng Jia-Gui Li Wei Feng Liang-Huan Cai Wei Cai Ya-Ping

Zhang Jing-Quan Li Bing Lei Zhi Wu Li-Li Wang Wen-Wu

(College of Materials Science and Engineering ,Sichuan University ,Chengdu 610064 ,China)

(Received 31 August 2006; revised manuscript received 26 January 2007)

Abstract

We have prepared polycrystalline CdTe thin films by close-spaced sublimation ,then the film surface was been etched by nitric-phosphoric acid. After etching ,the grain boundaries of CdTe thin films are broadened and it could be seen clearly that the surface became polished and more smooth , when observed by scanning electron microscope (SEM). After NP etching ,highly conductive Te-rich layer is formed on the surface of CdTe thin film ,as detected by X-ray diffraction (XRD). Four types of back-contact layers , including Cu , Cu/ZnTe :Cu , ZnTe :Cu and ZnTe/ZnTe :Cu were deposited respectively on the etched CdTe thin film ,and the influences on the solar cells performance were compared. Our studies showed that the performance of CdTe solar cells with ZnTe/ZnTe :Cu complex back-contact layer was better than those with other back-contact layers , and the highest conversion efficiency of 13.38% has been obtained for CdTe polycrystalline thin film solar cells of 0.5 cm² size.

Keywords : nitric-phosphoric acid etching , back-contact layer , CdTe solar cells PACC : 8160C , 7340L , 7360L

^{*} Project supported by the National High Technology Research and Development Program (863 program) of China (Grant No. 2003AA513010), the Specialized Research Fund for the Doctoral Program of Higher Education of China (Grant No. 2005060024) and the Application Foundation Program of Sichuan Province of China (Grant No. 2006J13-083).

[†] E-mail :xiaoxiong174@163.com